

適用規格				
定格	使用温度範囲	-55 °C ~ +85 °C (注1)	保存温度範囲	-10 °C ~ +60 °C (注2)
	電圧	AC 100 V	保存湿度範囲	40% ~ 70% (注2)
	電流	0.5 A(信号部) (注3) 3.0A(MF端子部)	使用湿度範囲	相対湿度85%以下 (但し結露の無いこと)
性能				
項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外觀, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	
	表示	目視にて確認する。		
電氣的性能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	信号部 : 90 mΩ以下 MF端子部 : 30 mΩ以下	○ -
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○ -
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○ -
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 60.0 N以下 引抜力 6.0 N以上	○ -
	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。		○ -
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗: 信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下	○ -
	温度サイクル	温度 -55 → +85 °C 時間 30 → 30 分を 5 サイクル試験する。 (槽の移し変え時間は2~3分)	② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2 °C 75±5%RH 96 時間放置する。 (試験規格: JIS C 60068)	はなはだしい腐食がないこと。	○ - ○ -
	はんだ耐熱性	リフローの場合: ピーク温度 MAX260°C 220 °C以上 60秒以内	外觀の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○ -
		はんだごての場合: こて温度 360°C はんだ付け時間 5 秒以内		○ -
はんだ付け性	はんだ温度 240±3 °C、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○ -	
△の数				
訂正記事		設計	検図	年月日
備考			承認	HS. OKAWA 12. 04. 10
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検図	KI. HIROKAWA 12. 04. 09
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担当	AH. EDASHIGE 12. 04. 09
注3. 1端子当たりの定格電流となります。			製図	AH. EDASHIGE 12. 04. 09
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-343463-00	
HRS	製品規格表		製品名	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	
		FX18-100P-0.8SV10	CL579-0034-1-00	△ 1/1